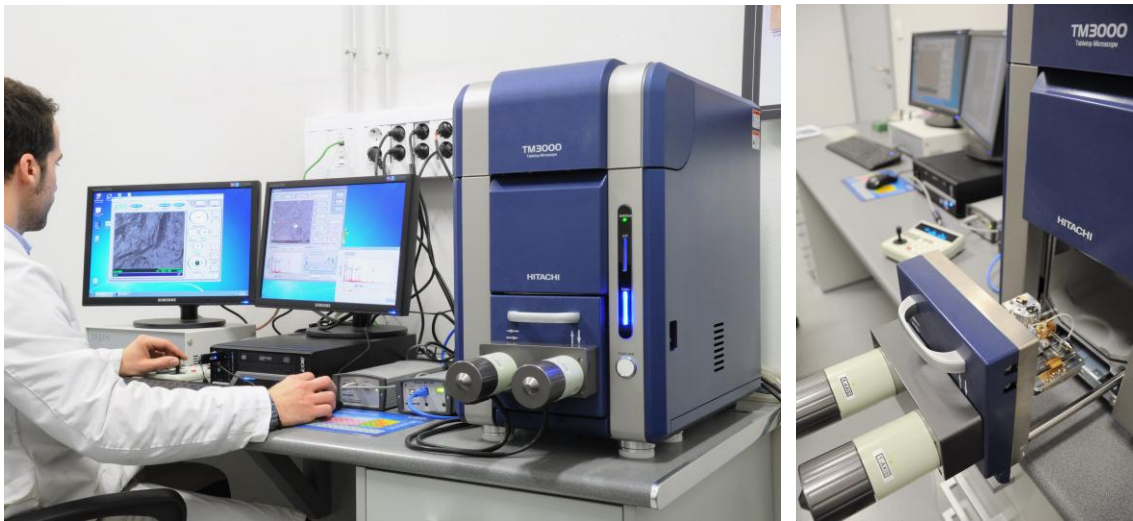


## Microscopía electrónica de barrido con microanálisis

Equipo: Microscopio electrónico **Hitachi TM-3000** asociado a microanalizador EDX modelo **Nano XFlash** de la casa **Bruker**.



**Características técnicas del microscopio electrónico Hitachi TM-3000:**

- Aumentos 40-30000
- Energías: 5kV para observación de superficies; 15kV para observación y composición.
- Autofoco; autobalance de brillo y contraste; sombreado direccional de la topografía (digital).
- Personalización de datos en las imágenes

**Características técnicas del microanalizador EDX Nano XFlash:**

- Identificación de elementos automática y análisis cuantitativo.
- Análisis de elementos ligeros desde boro en adelante (B, C, N, O, F,...)
- Energía de resolución de 135eV @ Mn K $\alpha$  con detector de 30 mm<sup>2</sup>
- MCA de 4096 canales (2.5eV/canal).

**Características del software Bruker Quantax 70**

- Selección y análisis puntual sobre la imagen SEM.
- Análisis de perfil lineal y mapeado ilimitado de elementos químicos.
- Extracción de matriz de datos analíticos para tratamiento posterior en PC.

